

Request Form for Translation

U. S. Serial No. : 09/915984

Requester's Name: Pald, Tarekh

Phone No. : 306-5859

Fax No. : 2829

Office Location: 284-5814

Art Unit/Org. : 2829

Group Director: Is this for Board of Patent Appeals?

Date of Request: 12/10/02

Date Needed By: 01/10/03

(Please do not write ASAP - indicate a specific date)

SPE Signature Required for RUSH:

Document Identification (Select One):

** (Note: Please attach a complete, legible copy of the document to be translated to this form) **

1. ☒ Patent Document No. DE 38 06 209 C2

Language German

Country Code DE

Publication Date 05/14/92

(filled by STIC)

No. of Pages

2. ☐ Article Author

Language

Country

3. ☐ Other Type of Document

Country

Language

Document Delivery (Select Preference):

Date: (STIC Only)

Date: (STIC Only)

Date: (STIC Only)

Call for Pick-up

Fax Back

STIC USE ONLY

Copy/Search

Processor:

Date assigned:

Date filled:

Equivalent found:

Doc. No.:

Country:

Remarks:

Translation

Date logged in:

PTO estimated words:

Number of pages:

In-House Translation Available:

Contractor:

Name:

Priority:

Sent:

Returned:

Translation Branch
The world of foreign-prior art to you.



Phone: 308-0881
Fax: 308-0989
Location: Crystal Plaza 3/4
Room 2C01

To assist us in providing the most cost effective service, please answer these questions:

Will you accept an English Language Equivalent?

Yes (Yes/No)

Will you accept an English abstract?

No (Yes/No)

Would you like a consultation with a translator to review the document prior to having a complete written translation?

No (Yes/No)

Check here if Machine

Translation is not acceptable: (It is the default for Japanese Patents, '93 and onwards with avg. 5 day turnaround after receipt)

MACHINE TRANSLATION FEEDBACK FORM

Please fill out this form after reviewing your machine translation and return to Translations Branch, STIC, CP3/4. This information will help us determine the effectiveness of providing machine translations.

Filling out this form is entirely voluntary, and all information will be used solely by the Translations Branch for information purposes.

1. How much time did you spend reviewing the machine translation?

2. Did you find what you were looking for in the machine translation, or did you also request an oral translation for clarification?

3. Did you find that having a machine translation saved you time?

4. Please provide any other comments or suggestions.

**STIC Translations Branch is now offering Machine Translated
Japanese Patent Documents to all Technology Centers**

- The advantage of machine translation is faster turnaround time and lower costs.
- Presently, machine translation is available for Japanese Unexamined A (Kokai) documents 1993 onward and Japanese Patent B documents 1994 and onwards.
- When submitting your request for a Japanese document, it is important to clearly indicate if the requested document is an A or B document because the Japanese patent system reuses patent numbers.
- The vendor is supplying machine translations which have been reviewed by language and art area experts. However, at times, the sentence structure and syntax of machine translations can be awkward. When in doubt, please call one of the STIC Japanese translators for clarification. Their contact information is included here.
- We will continue to check if an English-language equivalent is available prior to processing a request and encourage using it, when possible.
- The attachments below provide additional information about the process and the service.
- Unless otherwise indicated, STIC will process requests from all TC's which meet these guidelines, as machine translation requests.

We welcome your feedback; included is an evaluation form which can be dropped off at the Translations Branch, or e-mailed to STIC-Translations Box.

John Graham	Arti Shah	Kristin Vajs
Branch Chief	Division Chief	Director
Translations	STIC	STIC

Attachments:

-Request Form:

-Machine Translation Information/Background:

-Internet Sites as Sources for Translations:

Note: Unexamined Japanese A (Kokai) documents can be viewed for free at the Japanese Web site: <http://www.ipdl.jpo-miti.go.jp/homepg.e.ipdl>. The translations are raw machine translations.

- Evaluation Form:

Translation Staff Information:

JOHN R. GRAHAM-Supervisor	- Room 103 - 308-3293
AKIKO SMITH	- Room 108 - 308-3244
JOHN M. KOYTCHEFF	- Room 106 - 308-1185
MARTHA WITBSKY	- Room 104 - 308-3282
STEVEN SPAR	- Room 105 - 308-3281
MATTHEW ALT	- Room 109 - 305-3530
CHISATO MOROHASHI	- Room 107 - 308-3279

Guidelines for Use of Machine Translations of Japanese Patents

Machine translations are an excellent, cost effective, rapid way of determining the information presented in a patent and identifying patents which are relevant. It is the quickest way to determine the essence of a particular foreign language document, i.e. "gisting". Machine translation is often used as a tool to aid human indexers by saving time spent in terminology lookups.

Approximately 27% of the requests for translation received in STIC are for Japanese patents from 1993 onwards. A few vendors have started offering machine translation of Japanese patent documents. The pilot indicated this type of service can play a role in helping examiners determine the basic information in Japanese patent.

Machine translation will help control translation costs, will improve the timeliness of translations, and in most cases provide an adequate product. Some machine translated patents or parts of patents will require human oral or written translation at a later point.

The following information is provided as background. Please keep these points in mind when using machine translations.

- When one has numerous Japanese documents submitted by an applicant, the MT product may prove sufficient to determine the basic information when the examiner considers it necessary to do so. Machine translation is good for determining if certain concepts or words appear in the patent and in providing an overall look at the content of the patent. STIC does not recommend its use in a court of law, unless consultation with a STIC translator has taken place.
- The meanings of words can be context-bound and the syntax is not always clear in machine translated text. The translated sentence structure may be confusing to interpret. The qualities of translations are good from the standpoint of terminology; grammar is often weak, but improving. When in doubt, a translator should be contacted. When a response to a rejection raises questions about the content of a foreign reference, the examiner should obtain at least a partial written translation of the portions in question.

- Any portion of a reference relied upon for a final rejection or appeal should be confirmed by a human translator, even if it is only a confirmation by a human translator of the accuracy of the MT translation. The confirmed translation of a disputed portion should preferably be included in the next office action.

- We will be using Human Assisted Machine Translations (MATS). MATS are an automated translation of text, using complex technology, from one natural language to another, by a computer. The translation is the reviewed by human translators. The MAT gives a quick idea of the content of the patent document, is cost effective and offers a quicker turnaround. The pilot vendor. Derwent promises 5-day turnaround time from the point their Japanese Office receives the request. STIC monitors their performance. Requests are transmitted to the Derwent US office by STIC after initial processing.

- The format of the machine translated documents provided -two columns of the original Japanese text and the English translation-is designed to facilitate the accurate selection of content for follow-up custom translation.

USPTO
Intranet

Home | About | Contact | Search | Intranet Home | Site Feedback

NPL Virtual Library | Translation Services | Internet Translation Tools | Patents Home | Site Feedback | NPL Home | STIC Catalog | Site Guide | EIC | Automation Training | RPS | Contact Us | STIC Staff | FAQ | Firewall | Authentication

Internet Translation Tools

There are many tools available over the Internet which may be useful to you when you need a quick answer to the meaning of a particular word or phrase in a foreign language. Below you will find a list of Internet sites that are used as additional tools by some of the STIC translators and may be useful to you. However, caution should be exercised when using any of these tools. The specific subject matter and context in which a given term or expression is used will frequently determine how it should be translated into English. Most online dictionaries do not provide an adequate number of alternative translations for a given term or subject matter-specific examples of usage.

For technical translations for various languages:
<http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp>

For non-technical terminology use:
<http://www.logos.it/dictionary>

A good source for multi-lingual glossary links with emphasis on German:
<http://www.jump.net/~fdietz/glossary.htm>

For German, French, Spanish, Portuguese and Italian:
<http://babelfish.altavista.com>

Another site for raw Machine Translations of Japanese Patents:
http://www.ipdl.jp.go.jp/homepg_e.ipdl

Additional sites include:
<http://translator.dictionary.com/text.html>
<http://www.factstaff.bucknell.edu/rbeard/diction.html>

If you have any questions about this information, feel free to call the Translations Branch at 308-0881 or one of the translators on staff. To see a list of the translators, their background and experience as well as their phone numbers and location, click here.

Submit suggestions to John Graham.

[Intranet Home](#) | [Index](#) | [Resources](#) | [Contacts](#) | [Internet](#) | [Search](#) | [Firewall](#) | [Web Services](#)

Last Modified: Monday, December 17, 2001 14:26:04



Patentschrift
DE 38 06 209 C 2

(21) Aktenzeichen: P 38 06 209.7-52
(22) Anmeldetag: 26. 2. 88
(43) Offenlegungstag: 8. 9. 88
(45) Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 14. 5. 92

G 01 M 11/00
G 02 F 1/03
G 02 B 27/42
H 01 L 21/68

(5) Int. Cl.:

G 01 N 21/88

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(30) Unionspriorität: (32) (33) (31)

27.02.87 JP P 45631/87

(73) Patentinhaber:

Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

(72) Vertreter:

Strehl, P., Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Schübel-Hopf, U., Dipl.-Chem. Dr. rer. nat., Groening,
H., Dipl.-Ing., Pat.-Anwälte, 8000 München

DE 32 04 295 A1
DE 30 31 816 A1
DE 28 12 956 A1
EP 00 17 371 B1
JP 56-16 542 B2
Technisches Messen, 49. Jg. 1982, S. 99-103.

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht gezogene Druckschriften:

Yamamoto, Yoko; Tanaka, Hitoshi; Mikami, Noboru,
Amagasaki, Hyogo, JP

(72) Erfinder:

(54) Vorrichtung zur Erfassung von Strukturdefekten einer Probe mit einer regelmäßigen Struktur durch
räumliches Filtern des von der Probe gebeugten Lichtes

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erfassung von Strukturdefekten einer Probe mit einer regelmäßig gen Struktur durch räumliches Filtern des von der Probe gebuchten Lichtes gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Vorrichtungen dieser Art dienen zum Erfassen von Defekten oder Fremdstoffen auf der Oberfläche einer regelmäßig angeordneten Teststruktur, wie einer integrierten Halbleiterschaltung, die einer Strukturierung unterzogen wurde, wobei ein optisches Raumfilter verwendet wird, mit dem ein Aufzeichner und Lösen von gebeugtem bzw. gebrochenem Licht von einer Probe im Echzeit-Betrieb möglich ist.

Eine Vorrichtung der vorgenannten Gattung ist aus der EP 00 17 371 B1 bekannt. Bei dieser Vorrichtung wird das von einer regelmäßig, fehlerfreien Struktur erzeugte Beugungsmuster von einem speziell auf das jeweilige Muster abgestimmten Raumfilter absorbiert, so daß hinter dem Raumfilter nur mehr Beugungsbilder vorhanden sind, die von einem Defekt verursacht werden. Zur Verbesserung der Defekterfassung ist ein Zweifarbenverfahren vorgesehen, das die Erkennung des Defekts erleichtern soll. Dabei wird ein statisches Raumfilter verwendet, das für die jeweils zu prüfende Struktur vorab hergestellt werden muß.

Aus der DE 28 12 956 A1 ist die Aufzeichnung eines Beugungsmusters auf einem photoelektronischen Aufzeichnungsmedium bekannt, wobei jedoch das Beugungsmuster zur Erzeugung einer realen Abbildung im Rahmen eines holographischen Verfahrens dient.

Aus der DE 32 04 295 A1 ist es bekannt, zum Löschen eines eingeschriebenen Bildes eines elektrooptischen Modulators inkohärentes Licht hoher Intensität sowie in Verbindung mit dem Modulator Polarisatoren und Analysatoren zu verwenden. Diese bekannte Anordnung dient jedoch zur Untersuchung nichtstrukturierter Oberflächen, die infolgedessen keine regelmäßigen Beugungsmuster erzeugen.

Aus "Technischen Messen" 49, Jg. 1982, S. 99—103 und DE 30 31 816 A1 sind photographische Raumfilter bekannt, wobei in der erstgenannten Literaturstelle der Begriff "Echzeit" definiert ist.

Ferner ist in der veröffentlichten japanischen Patentschrift 56-16 542 B2 (japanische Offenlegungsschrift 54-1 05 967) eine Vorrichtung beschrieben, mit der Fehler von Photomasken auf unterschiedlichen Chips kontinuierlich untersucht werden, insbesondere bei der Prüfung von Mustern mit Richtcharakteristiken, wie z. B. IC-Photomasken, die z. B. bei der Halbleiterherstellung verwendet werden sollen. Da ein Fourier-Spektrum eines normalen Musters in einem zu untersuchenden Gegenstand ein gewisses Richtvermögen aufweist, wird es durch ein Raumfilter hinter der Linse und einem diskontinuierlichen Muster, z. B. einem Fehler, der nicht ein normales Muster darstellt, in einer Fourier-Ebene expandiert, so daß es durch die Maske hindurchgehen kann. Alle runden Ecken des Chips passieren die Maske und werden in derselben Weise erlaßt wie der Fehler. Durch einen Vergleich der beiden Chips werden Signale erzeugt, die ungleichartig sind und als ein Fehler erkannt sowie weiter verarbeitet werden. Es erfolgt somit die Überprüfung einer Struktur unter Verwendung eines übertragenden Bildes der Probe.

In Fig. 1, die ein Blockdiagramm eines bekannten Reflexions-Strukturdefekt-Erfassungssystems zeigt, sind im einzelnen folgende Elemente dargestellt: ein Lichtquelle 1 für kohärentes Licht, wie ein Laser, ein Kollima-

und der Polarisator 18 und der Analysator 19 orthogonally zur optischen Achse und parallel zueinander angeordnet.
Die durch den elektro-optischen Effekt (Pockels-Effekt) des BGO-Materials 20a in einem solchen Raumfilter induzierte Phasendrehung ist zu der über dem BGO-Material 20a entwickelten Spannung proportional.
Wenn der Polarisator 18 und der Analysator 19 orthogonal zur optischen Achse und parallel zueinander angeordnet sind, und wenn die über dem BGO-Material 20a auftretende Spannung V ist, beträgt die Amplitude A des Ausgangssignals durch das BGO-Material 20a:

$$A = A_0 \sin \left(\frac{\pi}{2} \frac{V}{V_p} \right)$$

wobei V_p die über dem BGO-Material 20a entwickelte Spannung angibt, wenn die Phasendrehung 90° beträgt. Diese Spannung ist proportional zur Wellenlänge und beträgt $5,6 \text{ kV}$ bei einer Wellenlänge $\lambda = 533 \text{ nm}$, wobei V_p für die Dicke der Anordnung konstant ist.
Im folgenden wird der Betrieb des Raumfilters erläutert. Obwohl sich der Betrieb des BGO in Löschzyklus, Schreibzyklus und Leseszyklus unterteilen läßt, erfolgt bei der Erläuterung nur eine Unterteilung in zwei Betriebsarten, nämlich Löschzyklus und Schreib/Lese-Zyklus.
1) Löschzyklus

Wie in Fig. 4(i) dargestellt, wird über dem BGO eine Spannung von V_1 zu $V_{1/2}$ angelegt, und Löschlicht auf das BGO gerichtet. Aufgrund der Photoelektrizität des BGO wird die Spannungsdifferenz über dem BGO Null, womit dort keine Licht-Phasendrehung auftritt, und Eingangslichtstrahlen alle abgeschnitten werden. Dann wird, wie in Fig. 4(ii) gezeigt, das Löschlicht ausgeschaltet, und die oben angelegte Spannung wird invertiert. In diesem Zustand wird über dem BGO eine Spannung von $2V_1$ zu V_1 angelegt, die Licht-Phasendrehung wird etwa 90° , und das BGO läßt das meiste Licht durch.
2) Schreib/Lese-Zyklus

Wie in Fig. 4(iii) gezeigt, fällt bei Einstrahlung von Schreiblicht die Spannung über dem BGO aufgrund der Photoelektrizität des BGO allmählich ab, und der Betrag der Licht-Phasendrehung nimmt ab, so daß der Betrag des durchgelassenen Lichts kleiner wird. Je stärker das auf das BGO aufgebrachte Licht ist, desto größer ist der Betrag des abgeschnittenen Lichts.
Der Betrieb der Vorrichtung, in der das BGO verwendet wird, wird im folgenden unter Bezugnahme auf das Wellenformdiagramm nach Fig. 5 erläutert.
Wenn linear polarisiertes Ar-Laser-Licht durch den Halbspiegel auf die Probe 4 aufgebracht wird, die auf dem X-Y-Tisch 6 angeordnet ist, der sich mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt, wobei die Probe 4 einen regelmäßigen Strukturaufbau hat, wird das davon reflektierte Licht durch die Linse 7 fokussiert und man erhält ein Beugungsmuster auf dem BGO als elektro-optischem Material 20, das an der Position des Brennpunktes angeordnet ist, während man an der Photographieposition der Kamera 12 ein abgebildetes Muster erhält. In dieser Anordnung werden (1) der Schreibverschuß 3, (2) das BGO, (3) die Weiblichquelle 8, (4) der Leserverschuß 31 und (5) die Kamera 12 in der in Fig. 5 gezeigten zeitlichen

erfordert.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die aus der eingangs genannten Druckschrift bekannte und im Oberbegriff des Patentsanspruchs 1 dargestellte Vorrichtung so auszugestalten, daß das Raumfilter einfach und ohne aus der Vorrichtung entnommen zu werden erstellt werden kann, wobei auch die Positionierung der Probe vereinfacht sein soll.
Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die im kennzeichnenden Teil des Patentsanspruchs 1 angegebenen Merkmale. Eine vorzuziehende Ausgestaltung der Vorrichtung ist im Unteranspruch 2 gegeben.
Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels näher beschrieben. Es zeigt
Fig. 1 ein Blockdiagramm einer bekannten Strukturdefekt-Erfassungsvorrichtung;
Fig. 2 ein Blockdiagramm einer Strukturdefekt-Erfassungsvorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;
Fig. 3 eine schematische Ansicht des Aufbaus eines Raumfilters;
Fig. 4 eine graphische Darstellung zur Erläuterung des Betriebes des Raumfilters;
Fig. 5 ein Zeitdiagramm zur Erläuterung des Betriebs der in Fig. 2 dargestellten Vorrichtung;
Fig. 6 eine Längsschnittansicht des Aufbaus eines elektronisch-optischen Gerätes, wie es in der Strukturdefekt-Erfassungsvorrichtung verwendet wird; und
Fig. 7 eine erläuternde Darstellung eines Beugungsmusters, basierend auf gebeugtem Licht einer Normalstruktur.
In Fig. 2 ist das System in Form eines Blockdiagramms dargestellt, in dem die Teile, die denen in Fig. 1 entsprechen, mit denselben Bezugsziffern bezeichnet sind. Auf eine Erläuterung dieser - herkömmlichen - Teile wird hier verzichtet. In Fig. 2 sind folgende Elemente dargestellt: ein Schreibverschuß 3, eine Weiblichquelle 8, eine Leistungsquelle 11 für den optischen Raumfilter 10, eine Leistungsquelle 9 für die Weiblichquelle 8, eine Leistungsquelle 15 für die Steuerung des Schreibverschlusses 3, Leistungsquellen 9 und 11, ein X-Y-Tisch 6, eine Signalverarbeitungseinrichtung 13, eine Grundplatte 16, ein Polarisator 30 und ein Leserverschuß 31.
Der optische Raumfilter 10 hat die Funktion, in Echtzeit gebeugtes Licht einer Normalstruktur einer Probe aufzuzeichnen und gebeugtes Licht einer fehlerhaften Struktur abzuschneiden. Der Raumfilter 10 dient auch dazu, das aufgezeichnete Beugungsmuster in Echtzeit zu löschen.
Der Raumfilter 10 ist beispielsweise aus einem elektrooptischen Material (PROM-Element) 20, das eine Photoelektrizität und einen Pockels-Effekt zeigt, wie z.B. BSO ($\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$) (vgl. "Optronics" Nr. 11, 1984, Seite 59-64) oder BGO ($\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$) (vgl. "Kogaku", Vol. 14, Nr. 1, 1985, Seite 19-28), aus einem Polarisator 18 und einem Analysator 19 aufgebaut.
Im folgenden werden nun beispielhaft "Ab-schneid"-Charakteristika eines Raumfilters beschrieben, das unter Verwendung von BGO als dem elektro-optischen Material aufgebaut ist.
Wie in Fig. 3 gezeigt, werden beim Aufbau dieses Raumfilters auf beiden Seiten des BGO-Materials 20a isolierende Filme 20b und 20c ausgebildet, anschließend durchsichtige Elektroden 20d und 20e auf die Außenseiten der isolierenden Filme 20b bzw. 20c aufgebracht.

chen Abfolge bzw. Abstimmung betrieben. Als Folge davon wird es möglich, nur das Bild der fehlerhaften Struktur, frei von der regelmäßigen Struktur, mittels eines Prozessors zu verarbeiten. Im folgenden wird das Zeitdiagramm nach Fig. 5 erläutert.

Ein Auslösestrigger erfolgt unter Verwendung eines Vertikal-Synchronisationssignals der Kamera 12, die als Detektor dient. Folglich beträgt ein Zyklus 1,30 sec und es erfolgt eine Einteilung in die drei Schritte: Lö- schen, Schreiben und Lesen. Diese Schritte werden im folgenden nacheinander erläutert.

Beim Schließen des Leseverschlusses 31 wird der Schreibverschluss 3 geschlossen, um das Laser-Licht abzuschneiden, und die Weißlichtquelle 8 wird eingeschaltet. Nach Aufbringen einer hinreichenden Menge von Licht auf die Teststruktur wird die Weißlichtquelle 8 ausgeschaltet. Nach Bestätigung dieses Vorganges wird die Spannung des BGO als elektro-optischen Materials 20 in Erwartung des Schreibbeginns invertiert.

b) Schreib-Schritt

Nach Verstärken einer bestimmten Zeit nach der Ausgabe des Vertikal-Synchronisationssignals der Kamera 12 wird der Schreibverschluss 3 geöffnet, um für den Start des Schreibens den Laser-Strahl abzusenden. Die Verzögerungszeit wird auf Grundlage der Zeit berechnet, die erforderlich ist, um Laser-Licht in einer Menge zu liefern, die für die Vorbereitung eines räumlichen Filters notwendig ist.

c) Lese-Schritt

Während der Vertikal-Synchronisationsperiode der Kamera 12 (die Periode, während der die Kamera kein Signal auslöst), wird der Leseverschluß 31 für nur 63,5 µsec. geöffnet, und ein Fehlersignal wird auf die photographische Ebene der Kamera gedruckt. Die Freigabezeit des Leseverchlusses 31 wurde aus der Bedingung bestimmt, daß sich ein sich bewegendes Bild nur um ein Bildelement auf der Bildebene bewegt.

Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht, in der der Aufbau eines elektro-optischen Materials 20 dargestellt ist, das in der Strukturdefekt-Erfassungsvorrichtung verwendet wird. In Fig. 6 sind mit den Bezugsziffern 21, 22, 23, 24 und 25 eine Einkristallplatte, ein Isolator, eine durchsichtige Elektrode, das einfallende Licht bzw. das austretende Licht bezeichnet. Die Bezugsziffern 26 und 27 bezeichnen jeweils eine Anschlußelektrode.

Der Betrieb dieser elektro-optischen Vorrichtung wird auch unter Bezugnahme auf Fig. 2 erläutert.

Licht mit einer Wellenlänge von 488 nm, das von dem als eine Lichtquelle 1 für kohärentes Licht dienenden Argon-Laser emittiert wird, wird durch den Kollimator 2 aufgespreizt, durch den Halbspiegel 5 reflektiert und auf die von einem Halbleiter-Wafer gebildete Probe 4 aufgebracht. Das von der Probe 4 reflektierte Licht tritt durch den Halbspiegel 5 und erreicht dann, fokussiert durch die Linse 7, den durch den optischen Raumfilter 10 gebildeten Filterbereich. Das Licht, das durch den Polarisator 18 getrieben ist, erreicht das elektro-optische Material 20, auf dem nur intensives Licht aufgrund der Photoelektrode aufgezichnet wird, um die auf dem Pockels-Effekt basierende Doppelbrechung zu verändern. Wenn die normale Struktur der Probe ein sich

Wie beschrieben, wird ein Raumfilter verwendet, mit dem eine räumliche Filterung gebeugten Lichts von einer Probe erfolgt und mit dem Aufzeichnen und Lö- schen im Echtzeit-Betrieb durchgeführt werden kann, so daß das Filter in sehr kurzer Zeit hergestellt werden kann, ohne daß ein photographischer Entwicklungspro- zess erforderlich ist. Da es daneben nicht nötig ist, den Neigungswinkel und den Drehwinkel einer Probe zu korrigieren, kann die für die Erfassung erforderliche Zeit in einem starken Maß verringert werden, und es ergibt sich eine Defekt-Erfassungsvorrichtung, die, im Vergleich zum Stand der Technik, einen einfacheren

Es treten manchmal Fälle auf, in denen die Teststruk- tur extrem fein ist, so daß Lichtstrahlen höherer Ord- nung die Kondensorlinse verlassen. In solchen Fällen ist es nicht notwendig, daß die Wellenlänge beim Aufzeich- nen und die bei der Überprüfung übereinstimmen. Es ist möglich, für die Aufzeichnung eine Lichtquelle in einem Wellenlängenbereich zu wählen, bei dem sich eine hohe Absorption des optischen Raumfilters ergibt, und für die Erfassung von Defekten einen He-Ne-Laser oder ähnli- ches zu verwenden.

Wie beschrieben, wird ein Raumfilter verwendet, mit dem eine räumliche Filterung gebeugten Lichts von ei- ner Probe erfolgt und mit dem Aufzeichnen und Lö- schen im Echtzeit-Betrieb durchgeführt werden kann, so daß das Filter in sehr kurzer Zeit hergestellt werden kann, ohne daß ein photographischer Entwicklungspro- zess erforderlich ist. Da es daneben nicht nötig ist, den Neigungswinkel und den Drehwinkel einer Probe zu korrigieren, kann die für die Erfassung erforderliche Zeit in einem starken Maß verringert werden, und es ergibt sich eine Defekt-Erfassungsvorrichtung, die, im Vergleich zum Stand der Technik, einen einfacheren

wiederholendes Muster aufweist, erscheint in diesem Fall ein Beugungsmuster, wie es in Fig. 7 gezeigt ist, auf der Ebene des optischen Raumfilters 10, der in der Brennebene der Linse angeordnet ist. Damit zeichnet der optische Raumfilter 10 nur gebeugtes Licht mit ei- ner hohen Intensitätsverteilung auf und verändert die Doppelbrechung. Andererseits ist gebeugtes Licht von einer Struktur, die kein sich wiederholendes Muster hat, schwach, so daß es kaum aufgezeichnet wird, und damit keine Veränderung in der Doppelbrechung auftritt. Das bedeutet, daß das intensive Beugungssignal von einer Normalstruktur und das schwache Beugungssignal von einem Defekt durch Bereiche tritt, die sich in der Dop- pelbrechung unterscheiden, so daß sich die austretenden Lichtstrahlen in ihrem Polarisationszustand unterschei- den. Wenn eine polarisierende Platte, die die Polarisat- ion des Beugungssignals der Normalstruktur abfängt, als der Analysator 19 auf der Ausgangsseite der Vorrich- tung angeordnet ist, wird das Beugungssignal von einem Defekt auf die Kamera 12 aufgetrennt und als ein Defekt- signal erfaßt werden.

Damit kann die Erfassung eines Fehlersignals erfol- gen, indem nur eine extrem kurze Zeitdifferenz bezüg- lich des räumlichen Filters vorgesehen wird, der das Beugungsmuster der Normalstruktur aufgezeichnet hat. Für die Überprüfung der nächsten Probe wird das La- serlicht einmal mit dem Schreibverschluss 3 abgeschnit- ten, und dann die Weißlichtquelle 8 für einen Moment eingeschaltet, um das aufgezeichnete Beugungsmuster auf dem optischen Raumfilter 10 zu löschen.

Dann wird erneut eine Spannung angelegt, um das Filter zu initialisieren, während die Probe bewegt wird, und der Verschluss wird erneut freigegeben, um die Ein- strahlung von Laser-Licht zuzulassen, wodurch die Überprüfung erfolgt, ob ein Defekt vorliegt oder nicht. Dieses Verfahren wird bis zum Ende der Untersuchung wiederholt.

Obwohl im oben beschriebenen Ausführungsbeispiel der Strukturdefekt-Erfassungsvorrichtung auf die Er- fassung eines Defekts einer integrierten Halbleiter- schaltung als Probe Anwendung fand, ist es neben inte- grierten Halbleiterschaltungen auch auf andere Objekte anwendbar, beispielsweise auf eine feine Struktur mit einer Spiegelfläche und einer regelmäßigen Anord- nung oder auf eine Maske, die ein Übertragungs- oder Durchlaßmuster darstellt.

1. Vorrichtung zur Erfassung von Strukturdefekten einer Probe mit einer regelmäßigen Struktur durch räumliches Filtern des von der Probe gebeugten Lichtes, mit

Bestrahlern der Probe.

— einer Linse zum Fokussieren des von der Probe kommenden Lichtes auf ein optisches

Raumfilter, das ein von einer Probe ohne Strukturdefekte herrührendes Beugungsmu-

stern zur Ausfilterung des von der regelmäßigen Struktur herrührenden Lichtanteils auf-

weist,

— einer Kamera in der Bildebene der Linse zur Erfassung der Strukturdefekte,

— einer Steuereinheit,

— einer Signalverarbeitungseinrichtung,

dadurch gekennzeichnet, daß

— das optische Raumfilter (10) ein photoelekt-

risches elektro-optisches Material (20) zum Auf-

zeichnen des Beugungsmusters der zu untersu-

chenden Probe (4) in Echtzeit aufweist,

— das photoelektische elektro-optische Mate-

rial (20) zwischen einem Polarisator (18) und

einem Analysator (19) angeordnet ist,

— eine mit einer Leistungsquelle (9) verbun-

dene Einrichtung (Weißlichtquelle 8) zum Lö-

schen eines im photoelektischen elektro-opti-

schen Material (20) aufgezeichneten Beu-

gungsmusters zum Erhalt eines aufnahmefäh-

igen photoelektischen elektro-optischen Mate-

rials (20) vorgesehen ist,

— ein zum Einschreiben des Beugungsmusters

in das aufnahmefähige photoelektische elektro-

optische Material (20) des optischen Raumfil-

ters (10) zu öffnender Schreibverschluß (3) und

ein Polarisator (30) zwischen der Lichtquelle

(1) und dem optischen Raumfilter (10) ange-

ordnet sind und daß eine Leistungsquelle (11)

zur Aktivierung des photoelektischen elektro-

optischen Materials (20) vorgesehen ist,

— ein zur Erfassung eines Fehlersignals zu öff-

nender Lesevererschluß (31) zwischen dem opti-

schen Raumfilter (10) und der Kamera (12) an-

geordnet ist, und daß

— die Steuereinheit (15) zur Steuerung des

Lesevererschlusses (31), des Schreibverschlusses

(3) und der beiden Leistungsquellen (9, 11) aus-

gebildet ist,

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daß das photoelektische elektro-optische

Material (20) des optischen Raumfilters (10) einen

Pockels-Effekt zeigt und daß auf der Eingangsseite

des elektro-optischen Materials (20) der Polarisator

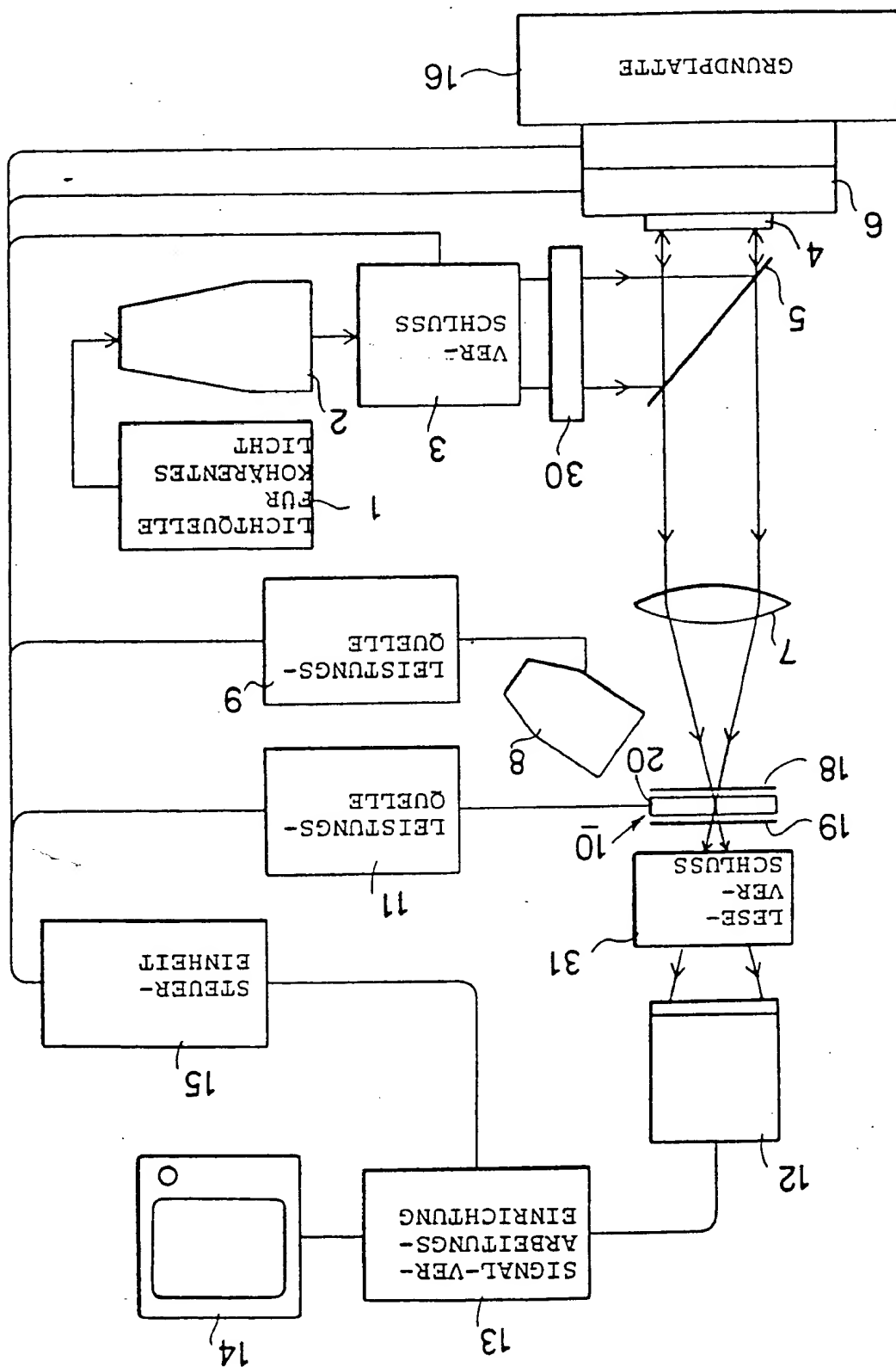
(18) und auf der Ausgangsseite des elektro-opti-

schen Materials (20) der Analysator (19) vorgese-

hen sind.



FIG. 2



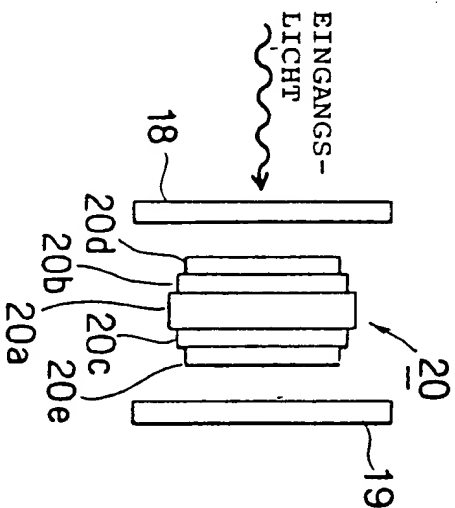


FIG. 3

FIG. 4 (i) LÖSCH-LICHT ANLEGEN

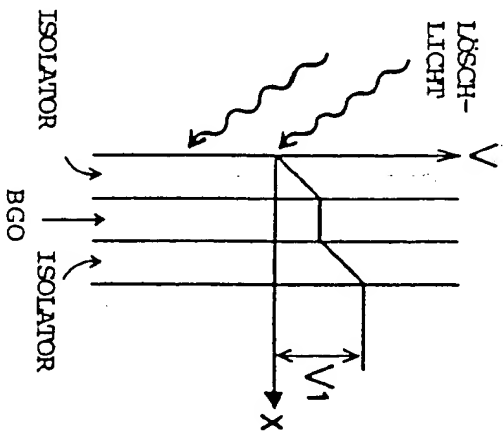


FIG. 4 (ii) SPANNUNG INVERTIEREN

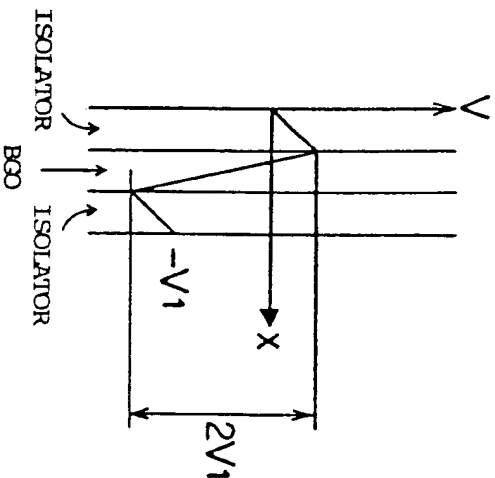
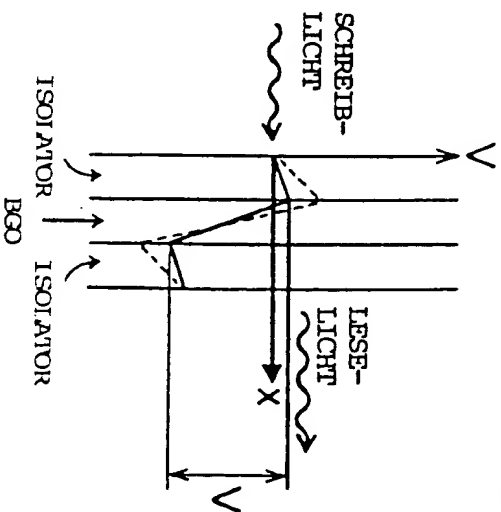


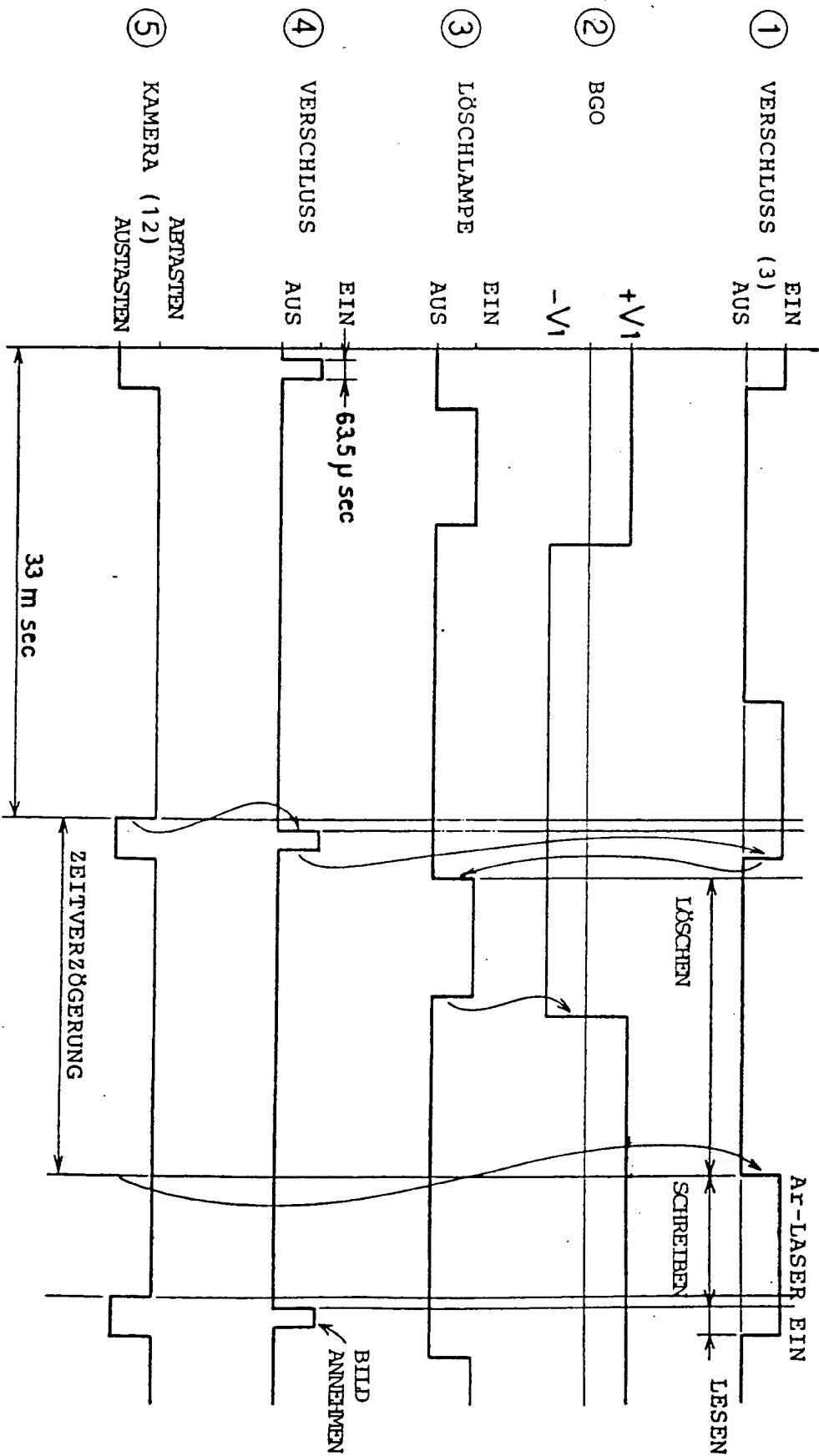
FIG. 4 (iii) SCHREIB-LICHT ANLEGEN



(I) LÖSCHZYKLUS

(II) SCHREIB/LESE-ZYKLUS

FIG. 5



Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101
 Hollywood, FL 33022-2480
 Post Office Box 2480
 Lerner and Greenberg, P.A.

Applicant: Udo Hartmann
 Applic. # _____

Docket # MCM 11618

208 120/187

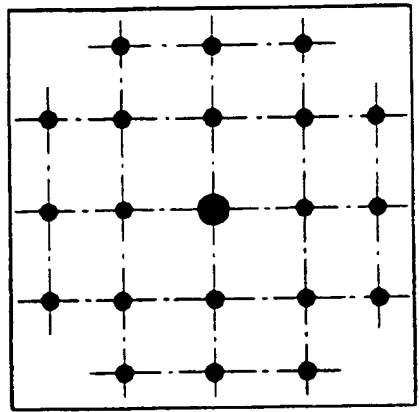


FIG. 7

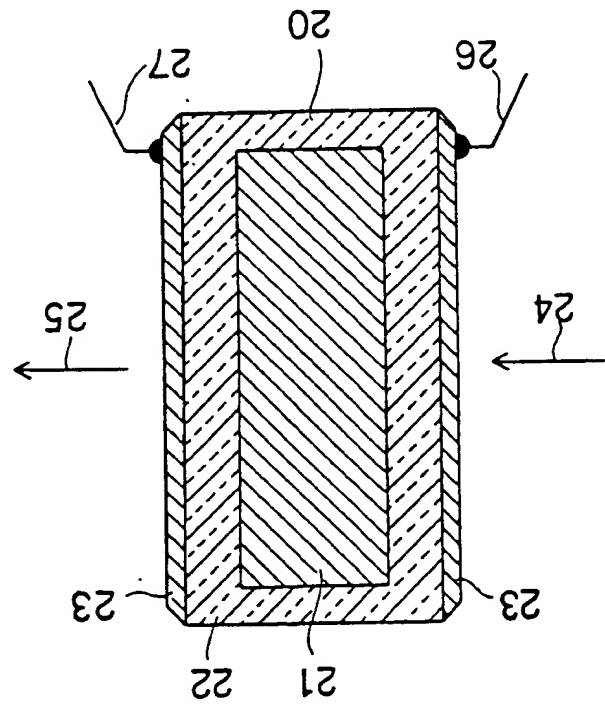


FIG. 6